

1. Record Nr.	UNINA9910710225203321
Autore	Carver G. P
Titolo	Microelectronic test patterns NBS-12 and NBS-24 // G. P. Carver; R. L. Mattis; M. G. Buehler
Pubbl/distr/stampa	Gaithersburg, MD : , : U.S. Dept. of Commerce, National Institute of Standards and Technology, , 1981
Descrizione fisica	1 online resource
Collana	NBSIR ; ; 81-2234
Altri autori (Persone)	BuehlerM. G CarverG. P MattisRichard L
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Note generali	1981. Contributed record: Metadata reviewed, not verified. Some fields updated by batch processes. Title from PDF title page.
Nota di bibliografia	Includes bibliographical references.